

HPS2661、HPS2662、HPS2663、 HPS2663A

精密四探针电阻率测试仪

HPS2661/2662/2663 系列精密四探针电阻率测试仪,可根据不同材料特性需要,有多种测试探头可供选择。有高耐磨碳化钨探针探头,以测试硅类半导体、石墨烯、热敏材料、金属、导电塑料等硬质材料的电阻率和方阻;也有球形镀金铜合金探针探头,可测试柔性材料导电薄膜、PE膜、电容卷积膜、金属箔、金属涂层或者碳纸、薄膜、陶瓷、玻璃基底上导电膜(ITO膜)、锂电池电极片、氢燃料电池电极片或纳米涂层等半导体材料的电阻率和方阻。仪器适用于半导体材料厂、高等院校和科研单位对导体、半导体材料导电性能的测量。



性能特点

- ❖ 超大液晶人性化操作界面
- ❖ 多种测量参数可选
- ❖ 测量数据自动保持功能
- ❖ 超快测量并显示读数
- ❖ 量程有自动和手动双模式
- ❖ 档号显示及档计数功能
- ❖ 兼容多种材料测量
- ❖ 专业的通讯接口可以与 PC 进行数据通讯及对仪器的远程控制

应用

- 金属片、导电金属箔材料、金属箔上涂层
- 单晶硅、多晶硅、硅片、硅晶棒、硅锭、硅块料
- 石墨烯、锂电池电极、氢燃料电池双极板、太阳能电池片

技术参数

产品型号	HPS2661	HPS2662	HPS2663	HPS2663A
性能指标				
显示器	高清 LCD 液晶显示			
显示位数	6 位			
测量范围和精度				
电阻率	10 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ - 200k $\Omega\cdot\text{cm}$	1 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ - 2M $\Omega\cdot\text{cm}$	1 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ - 20M $\Omega\cdot\text{cm}$	0.1 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ - 20M $\Omega\cdot\text{cm}$
方块电阻	50 $\mu\Omega/\square$ - 1M Ω/\square	10 $\mu\Omega/\square$ - 2M Ω/\square	10 $\mu\Omega/\square$ - 20M Ω/\square	1 $\mu\Omega/\square$ - 20M Ω/\square
模拟电阻	10 $\mu\Omega$ - 200k Ω	1 $\mu\Omega$ - 2M Ω	10 $\mu\Omega$ - 20M Ω	1 $\mu\Omega$ - 20M Ω
精度	电阻率、方阻：4%；模拟电阻：0.1%；			
测量功能				
量程方式	自动，保持			
测量速度	快速: 10 次/秒, 中速: 5 次/秒, 慢速: 2 次/秒			
触发方式	内部, 手动, 外部			
分选和接口				
分选功能	内建比较器：合格、上超和下超			
讯响	合格, 不合格, 关闭			
接口配置	RS-232C 接口/HANDLER/USB Device (选件)			
一般规格				
操作环境	0 $^{\circ}\text{C}$ - 40 $^{\circ}\text{C}$, \leq 90%RH			
保证精度环境	23 \pm 5 $^{\circ}\text{C}$, \leq 80%RH			
电源要求	198V - 242V(AC) , 47.5Hz - 63Hz			
功耗	\leq 30 VA			
尺寸、重量	335 mm(宽) x 120 mm(高) x 320 mm(深) 5.5kg			

标配附件

- HPS58001 四探针测试台
- HPS58006D 四探针测试探头 (间距 2mm)
- HPS110 AC 电源线
- HPS105 RS232 通讯线缆
- PLC 接线端子
- 四探针测试专用修正软件 (终身免费升级)

选配附件

- HPS58002 四探针测试探头 (直线 1mm)
- HPS58006A 四探针测试探头 (直线 1mm)
- HPS58016A 四探针测试探头 (矩形 1mm)
- HPS58016D 四探针测试探头 (矩形 2mm)
- HPS58005E 四探针测试探头 (直线 2.5mm)
- HPS58009 二探针测试探头
- 专用定制型附件：行业专用测试治具、上位机采集软件 (根据用户需求定制)